



## Protokoll 3. Treffen Arbeitskreis „optische Sensorsysteme“

Veranstaltungsort: TWIP optical solutions, Nobelstraße 15, Stuttgart

Am: 16.05.2014

Schwerpunktthema: „Eignungsnachweis von Messsystemen“

### Agenda:

- 11<sup>00</sup> – 11<sup>15</sup>** Begrüßung der Teilnehmer, Blick auf unsere Themenliste, Zusammenfassung des Vortreffens zum Thema „Modellbasierte Charakterisierung des Messsystems und seiner Wechselwirkung mit realen Objekten“
- 11<sup>15</sup> – 12<sup>15</sup>** Fachvorträge der Gastgeber
- 11<sup>15</sup> – 11<sup>45</sup>** F. Mauch, Institut für Technische Optik, Stuttgart „Modellgestützte Untersuchung der objektabhängigen Messunsicherheit konfokaler Sensoren bei der Inspektion rauer Oberflächen.“
- 11<sup>45</sup> – 12<sup>15</sup>** Dr. W. Lyda, TWIP – optical solutions  
„Vorstellung der TWIP – optical solutions“  
„ITOM eine open source Mess-, Automatisations- und Evaluationssoftware“
- 12<sup>15</sup> – 13<sup>00</sup>** Mittagsimbiss
- 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>** Leitthema: „Messunsicherheit und Eignungsnachweis von Messsystemen“
- 13<sup>00</sup> – 13<sup>45</sup>** Dr. E. Dietrich, q-das, „Eignungsnachweis von Messsystemen“
- 13<sup>45</sup> – 14<sup>30</sup>** Dr. D. Imkamp, Carl Zeiss IMT, „Erfahrungen bei der Abschätzung von Messunsicherheit und Prüfmittleignung mit einem Prüfkörper für Koordinatenmessgeräte mit taktiler und Kamera-Sensorik“
- 14<sup>30</sup> – 14<sup>45</sup>** Kaffeepause
- 14<sup>45</sup> – 15<sup>15</sup>** Dr. R. Köning, PTB, „Ausgewählte Aspekte der Messunsicherheitsbestimmung uni- und bidirektionaler Messungen“
- 15<sup>15</sup> – 15<sup>45</sup>** **Diskussionsrunde:** „Messunsicherheit – welche weiteren Aspekte gibt es, gibt es Bedarf für weitere Aktionen?“
- 15<sup>45</sup> – 16<sup>00</sup>** wrap up & Agenda für nächstes Treffen
- 16<sup>00</sup>** Ende der Veranstaltung



### Begrüßung:

Durch den Gastgeber H. Dr. Lyda und den Sprechern des Arbeitskreises.

H. Lyda gab einen Einblick in die Aktivitäten der TWIP optical solutions

H. Heinrich informierte die Mitglieder über den aktuellen Diskussionsstand zum Schwerpunktthema „Modellbasierte Charakterisierung des Messsystems und seiner Wechselwirkung mit realen Objekten (Vollständige realistische Simulation von optischen Messgeräten).“

Dazu fand im Vorfeld des Arbeitskreises eine Diskussion zwischen dem IPT Aachen, der TWIP optical solutions, der MicroEpsilon, dem ITO Stuttgart, der HS Landshut und der HS Aalen statt. Ziel ist es hier gemeinsame Aktivität zu starten. Die Diskussion wird zum nächsten Arbeitskreistreffen fortgesetzt (als „Vormittagsmeeting“ vor dem eigentlichen AK Treffen)

### Leitthema: „Messunsicherheit und Eignungsnachweis von Messsystemen“

Die Fachvorträge von H. Dr. Dietrich, q-das, „Eignungsnachweis von Messsystemen“, H. Dr. D. Imkamp, Carl Zeiss IMT, „Erfahrungen bei der Abschätzung von Messunsicherheit und Prüfmittleignung mit einem Prüfkörper für Koordinatenmessgeräte mit taktiler und Kamera-Sensorik“ und H. Dr. R. Köning, PTB, „Ausgewählte Aspekte der Messunsicherheitsbestimmung uni- und bidirektionaler Messungen“ liegen zum Download bereit.

### Nächstes Treffen

Schwerpunktthema:

„Der Sensor als Informationssystem“ mit grundlegenden informationstheoretischen Betrachtungen zur Signalentstehung und Übertragung bei optischen Sensoren

Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am 07.10.14 am Fraunhofer IPT in Aachen statt.